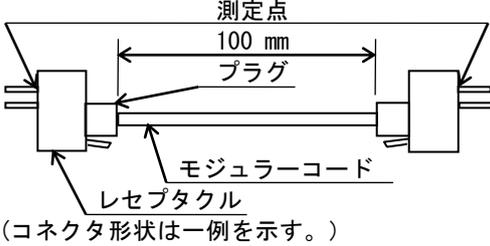


適用規格				
定格	使用温度範囲	-55 °C ~ +85 °C $\triangle$	保存温度範囲	-25 °C ~ +60 °C $\triangle$
	電圧	AC 125 V	電流	500 mA
性能				
項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	
	表示	目視にて確認する。		
電気的性能	接触抵抗	100 mA (DC OR 1000 Hz AC)で測定する。  (コネクタ形状は一例を示す。)	230 mΩ以下	○ ○
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	100 MΩ以上	○ ○
	耐電圧	AC 500 Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○ ○
機械的性能	繰り返し動作	200回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗: 250 mΩ以下 ② 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○ -
	耐振性	周波数 10 ~ 55 Hz, 片振幅 0.75 mmで 3方向各2時間試験する。	① 5 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: 250 mΩ以下 ③ 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○ -
	耐衝撃性	加速度 490 m/s <sup>2</sup> , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3方向各3回試験する。	③ 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○ -
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 40 °C, 湿度 90 ~ 95 %中に 500時間放置する。	① 接触抵抗: 250 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 1 MΩ以上 (高温時) 10 MΩ以上 (乾燥時) ③ 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○ -
	温度サイクル	温度 -55±3 → 5~35 → 85±2 → 5~35 °C 時間 30~35 → 5以内 → 30~35 → 5以内分 を5サイクル試験する。	① 接触抵抗: 250 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上 ③ 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○ -
	塩水噴霧	濃度 5 %の塩水, 48時間放置する。	① 接触抵抗: 250 mΩ以下 ② はなはだしい腐食がないこと。	○ -
	はんだ耐熱性	はんだ温度 260 ± 5 °C, 浸漬時間 10 ± 1 秒間で試験する。	外観の変形及び端子などに著しいガタがないこと。	○ -
	はんだ付け性	はんだ温度 245 ± 2 °C, 浸漬時間 3 ± 1 秒間のはんだ付けを行う。	はんだ浸漬面の 95 %以上が新しい はんだで濡れていること。	○ -
$\triangle$ の数	訂正記事	設計	検図	年月日
$\triangle$ 2	DIS-E-00003174	KIM JAEHYEON	TU. TANIGUCHI	20201007
備考			承認	HO. MIWA 20050105
			検図	TH. KAMEYA 20050105
			担当	SS. SATOH 20050105
			製図	SS. SATOH 20050105
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。				
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC-023509-50-02	
<b>HRS</b>	製品規格表		製品名	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	
			TM5RJ1-88 (50)	
		CL222-1169-0-50	$\triangle$	1/1